PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

4

(11)Publication number:

2002-279618

(43)Date of publication of application: 27.09.2002

(51)Int.Cl.

G11B 5/66 G11B 5/738 H01F 10/16 H01F 10/30

(21)Application number: 2001-077414

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

19.03.2001

(72)Inventor: IGARASHI KAZUSUKATSU

AKAGI FUMIKO ZAITSU HIDEKI TOMIYAMA HIROSHI

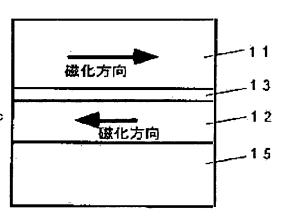
(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic recording medium suitable for the high density magnetic recording operation having the high resolution, low noise and small thermal fluctuation.

SOLUTION: This thin film type magnetic recording medium is provided with magnetic layers having at least two layers formed on a non-magnetic substrate, and a non-magnetic intermediate layer held between these magnetic layers to make the magnetization of them to be unparallel, and such magnetic recording medium is used that the ratio HkB/Hka of the magnetic anisotropic magnetic field HkB of the magnetic layer at the side near the substrate to the magnetic layer at the side far from the substrate is ≤0.7, more preferably ≥0.4 and ≤ 0.65.

図 3



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.10.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-279618 (P2002-279618A)

(43)公開日 平成14年9月27日(2002.9.27)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)	
G11B	5/66		G11B	5/66			
	5/738			5/738		5 E O 4 9	
H01F	10/16		H01F 1	0/16			
	10/30	10/30					
			審査請求	未請求	請求項の数17	OL (全 18 頁)	
(21)出願番号		特顧2001-77414(P2001-77414)	(71)出顧人				
(00) USS II		株式会社日立9				可台四丁目 6 番地	
(22)出顧日		平成13年3月19日(2001.3.19)	(70) \$\$ \$\$ ##-#s			11日四1日0番取	
			(72)発明者			五一丁目280番地	
					NDです中来なりを 上日立製作所中9		
			(72)発明者			ויין ולעולדושט	
			(化) 完明省			b	
						上一丁目280番地	
			(5.1) (5.77)		t日立製作所中央	代财 究所内	
			(74)代理人				
			,	并理士	作田康夫		
						最終頁に続く	

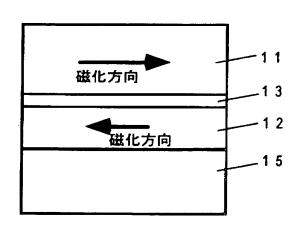
(54) 【発明の名称】 磁気記録媒体

(57)【要約】

【課題】 高分解能,低ノイズ,かつ熱揺らぎの小さな高密度磁気記録に好適な磁気記録媒体、及びこの媒体等を用いた場合に実現される大容量磁気記憶装置を提供する。

【解決手段】 非磁性基板上に形成された少なくとも 2 層の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒体であって、基板に近い側の磁性層の磁気異方性磁界HkBと,基板から遠い側の磁性層の磁気異方性磁界Hkaとの比HkB/Hkaが0.7以下,より好ましくは0.4以上0.65以下である磁気記録媒体を用いる。

図 3



【特許請求の範囲】

【請求項1】非磁性基板上に形成された少なくとも2層の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒体であって、基板に近い側の磁性層の磁気異方性磁界Hk1との、基板から遠い側の磁性層の磁気異方性磁界Hk1との比Hk2/Hk1が0.7以下であることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項2】上記異方性磁界の比Hk2/Hk1が0.4以上0.65 以下であることを特徴とする請求項1に記載の磁気記録 媒体。

【請求項3】非磁性基板上に形成された少なくとも2層の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒体であって、基板に近い側の磁性層Aの200ケルビンにおける保磁力と100ケルビンにおける保磁力とを絶対温度零度に外挿した値HcoAと,基板から遠い側の磁性層Bの200ケルビンにおける保磁力と100ケルビンにおける保磁力とを保磁力を絶対温度零度に外挿した値HcoBとの比Hco2/Hco1が0.7以下であることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項4】上記保磁力の比Hco2/Hco1が0.4以上0.65以下であることを特徴とする請求項2に記載の磁気記録媒体。

【請求項5】非磁性基板上に形成された少なくとも2層 の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平 行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒 体において、基板に近い側の磁性層Aの200ケルビン における保磁力と100ケルビンにおける保磁力とを絶 対温度零度に外挿した値をHcoA,基板から遠い側の磁性 層Bの200ケルビンにおける保磁力と100ケルビン における保磁力とを保磁力を絶対温度零度に外挿した値 をHcoB,磁気記録再生装置として組み合わせて用いる磁 気記録用ヘッドからの磁界のトラック方向成分が該トラ ックの中心かつ磁性層Aの厚み方向の中心でHcoAとなる 位置におけるヘッド磁界のトラック方向成分の該トラッ ク方向への微分値をdH/dx, 該磁気記録用ヘッドを用い て該磁気記録媒体上に形成された孤立遷移の磁化遷移幅 をπaとするとき,値(HcoAHcoB)/(πa×dH/dx)が0. 8以上であることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項6】上記値(HcoAHcoB)/ (πa×dH/dx) が0.9 以上, 1.5以下であることを特徴とする請求項5に記載 の磁気記録媒体。

【請求項7】非磁性基板上に形成された少なくとも2層の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒体であって、基板に近い側の磁性層の磁気異方性エネルギーKuBと,基板から遠い側の磁性層の磁気異方性エネルギーKuBとの比KuB/KuAが0.7以下であることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項8】上記比KuB/KuAが0.4以上0.65以下であることを特徴とする請求項7記載の磁気記録媒体。

【請求項9】30ケルビンにて、トラック方向に磁界を印加して磁気飽和させた後、磁界を毎秒3000A/mの大きさで磁界を減少させ、さらに逆方向に磁界を印加して磁気飽和に至らせる過程において、磁化の磁界による微分値が少なくとも2つ以上のピークを持ち、該ピークを与える磁界が全て最後に磁気飽和させた磁界の方向であることを特徴とする請求項1ないし8に記載の磁気記録媒体。

【請求項10】非磁性基板上に形成された少なくとも2層の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒体において、135ケルビンにて,トラック方向に磁界を印加して磁気飽和させた後,磁界を毎秒3000A/mの大きさで磁界を減少させ,さらに逆方向に磁界を印加して磁気飽和に至らせる過程において,磁化の磁界による微分値が少なくとも2つ以上のピークを持ち,該ピークを与える磁界のうち,少なくとも1つは最後に磁気飽和させた磁界の逆方向であることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項11】非磁性基板上に形成された少なくとも2層の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒体であって、基板に近い側の磁性層の飽和磁化が,基板から遠い側の磁性層の飽和磁化に比べて大きいことを特徴とする請求1ないし10に記載の磁気記録媒体。

【請求項12】上記基板に近い側の磁性層としてCoまたはCoを主成分とし、Fe, Ni, Cr, Ta, Pt, Pdの中から選ばれた少なくとも1種の元素を含む合金,好ましくは加えてB(ボロン)を含むことを特徴とする請求11に記載の磁気記録媒体。

【請求項13】上記非磁性中間層が、Ru、Ir、Rh、Re、Cu、Cr、AIからなる群から選ばれた少なくとも1種の金属元素を50at%以上含む合金、またはRu、Ir、Rhの中から選ばれた少なくとも1種類以上の元素とPt、Pdから選ばれた少なくとも1種類以上の元素との合計が50at%以上である合金であることを特徴とする請求項1ないし12に記載の磁気記録媒体。

【請求項14】上記非磁性中間層をRFスパッタ法で作成することを特徴とする請求項13に記載の磁気記録媒体。 【請求項15】上記基板から遠い側の磁性層がCo、Fe、Niからなる群から選ばれた少なくとも1種の金属元素を50at%以上含む結晶質磁性体を含み、更に、上記基板に近い側の磁性層がCr、Mo、W、Ta、V、Nb、Ta、Ti、Ge、Si、Co、Niからなる群から選ばれた少なくとも1種の元素を50at%以上含む非磁性下地膜上に形成されたことを特徴とする請求項1ないし14に記載の磁気記録媒体。

【請求項16】巨大磁気抵抗効果素子あるいは、磁気抵 抗効果を示すトンネル接合膜を用い、実効トラック幅が O. 5 μm以下である再生素子を有する磁気ヘッドと請求項1ないし15記載の磁気記録媒体とを組み合わせて磁気情報の再生を行うことを特徴とする磁気記憶装置。

【請求項17】記録部に、飽和磁束密度が1.8T以上の磁極を用いたヘッドを用いることを特徴とする請求項5,または6,または16に記載の磁気記憶装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子計算機及び情報処理装置等に用いられる磁気ディスク装置、ディジタルVTR等の情報家電用の磁気記憶装置及びその磁気記録媒体に係り、特に、高密度記録を実現する上で好適な磁気記録媒体およびこれを用いた磁気記憶装置に関する。

[0002]

【従来の技術】情報機器の記憶(記録)装置には、半導 体メモリと磁性体メモリ等が用いられる。高速アクセス 性の観点から内部記憶装置には半導体メモリが用いら れ、大容量・低コストかつ不揮発性の観点から外部記録 装置として磁性体メモリが用いられている。磁性体メモ リの主流は、磁気ディスク装置、及び磁気テープ、磁気 カード装置である。磁気ディスク、磁気テープや磁気カ 一ドといった記録媒体に磁気情報を書き込むため、強磁 界を発生する磁気記録部が用いられる。更に、髙密度で 記録された磁気情報を再生するため、磁気抵抗現象ない しは、電磁誘導現象を利用した再生部が用いられる。最 近では、巨大磁気抵抗効果、トンネル型磁気抵抗効果も 検討され始めている。これら機能部は、磁気ヘッドと呼 ばれる入出力用部品に共に設けられている。図10に磁 気ディスク装置の基本構成を示す。同図(a)は、装置 の平面図、(b)は(a)に示されたA-A'での断面図を 示す。記録媒体101は、回転軸受け104に固定さ れ、モータ100により回転する。図10では5枚の磁 気ディスク、10本の磁気ヘッドを搭載した例におい て、磁気ディスク3枚分と磁気ヘッド4本について示し たが、磁気ディスク1枚以上、磁気ヘッド1本以上であ れば良い。磁気ヘッド102は、回転する記録媒体面上 を移動する。磁気ヘッドは、アーム105を介してロー タリアクチュエータ103に支持される。サスペンショ ン106は、磁気ヘッド102を記録媒体101に所定 の荷重で押しつける機能を有する。再生信号の処理及び 情報の入出力には、所定の電気回路が必要である。最近 では、PRML(Partial Response Maximum Likelihood)、 あるいはこれをエンハンスしたEPRML(Extended PRML)と 言った、高密度化時の波形干渉を積極的に活用した信号 処理回路が導入され、高密度化に大きく寄与している。 これらは、ケース108等に取り付けられる。磁気ヘッ ドに搭載される情報の書き込み及び再生機能部は、例え ば図11に示す構造から構成される。書き込み部111 は、渦巻き型コイル116とこれを上下に包みかつ磁気

的に結合された磁極117と磁極118から構成される。磁極117と磁極118は、共に磁性膜パターンから構成される。再生部112は、磁気抵抗効果素子113と同素子に定電流を流し、かつ抵抗変化を検出するための電極119から構成される。これら書き込み部と再生部の間には、磁気的なシールド層を兼ねる磁極118が設けられている。磁気抵抗効果素子113の下層にはさらにシールド層115が設けられている。再生分解能は、このシールド層115と磁極(シールド層兼用)118との間隙長が短いほど大きくなる。以上の機能部は、上記磁気ヘッドスライダ1110上に形成されている。【0003】

【発明が解決しようとする課題】磁気記録ディスク装置 を大容量化するには,図10の記録媒体101に記録さ れる磁化情報を髙密度化すればよい。しかし、従来用い られている磁気記録媒体は微小な結晶粒子で構成されて いるため、高記録密度化に伴い1ビットあたり粒子数が 少なくなりノイズが大きくなるという問題があった。こ れに対し, 磁性粒子径を小さくし, 磁性粒界での非磁性 成分の偏析を促進して磁性粒子間の相互作用を小さくす ることでノイズ低減を図って来ている。ところが、最近 の年率50%以上の効率でさらに記録密度を高め15Gb/in2 程度以上の面記録密度で記録再生しようとすると、磁性 粒子の体積が小さくなるのに伴い、熱揺らぎによる記録 磁化の減衰(熱減磁)が深刻な問題となっている。これ は、媒体を構成する粒子の磁化が熱で反転させられる現 象で、ノイズ低減のために粒子の径を小さくすると顕著 になる。このため、岩崎らによって提案された垂直磁気 記録法式では、この熱揺らぎの影響が緩和されることが 期待されている。また2000年のIntermag国際会議では、 熱減磁抑制対策として富士通、IBMより、磁性層がRuを 介して反強磁性的に結合した面内媒体(AFC媒体と呼 ぶ)が提案された。この新しく提案された媒体は、書き 込み磁界が大きくなってしまい、熱減磁抑制メリットが 相殺されてしまう可能性が高いと考えられていた。ここ で、図3を用いて本発明のペースとなる反強磁性結合 (AFC) 媒体について説明する。図3は媒体の断面構造 を概念的に示したものである。非磁性基板15上に形成 された下層磁性層12, さらに非磁性中間層13を介し て形成された記録磁性層11からなる。非磁性中間層1 3としてRuを用いると、記録磁性層11と下層磁性層1 2との間に交換相互作用が働くようになる。このときの 結合エネルギーJは、Ru非磁性中間層13の厚さに対し て図4に示すような振動的な変化をする。 記録磁性層1 1の磁化方向と下層磁性層12の磁化方向は、交換結合 エネルギーJが負の値をとるときには反平行に、交換結 合エネルギーJが正の値をとるときには平行に配置する ような交換相互作用が働く。そこでRu非磁性中間層13 の厚さを負値のピークの厚さに設定することにより、記 録磁性層11の磁化と下層磁性層12の磁化とを反強磁

性的(反平行)に結合させることが可能となる。記録磁 性層11の膜厚と残留磁化の積は,下層磁性層12の膜 厚と残留磁化の積より大きく採るものとする。簡単の為 に, 記録磁性層11と下層磁性層12の飽和磁化Ms, 磁 気異方性エネルギーKuを同じと仮定し, 記録磁性層 1 1 の粒子体積をv1, 下層磁性層12の粒子体積をv2とす る。反強磁性相互作用が十分強い場合には, 大きいほど 耐熱揺らぎ性が向上する指標となるK & (=Ku*v/(k*T), k:ボルツマン定数, T:絶対温度)値がKu(v1+ v2)/(k* T)となり、記録磁性層11単独の(Ku*v1)/(k*T)に比べ て,下層磁性層 1 2の持つKβ値((Ku*v2)/(k*T))だけ 大きくなり,熱的に安定となる。ところが,記録磁性層 11の磁化と下層磁性層12の磁化とが反平行であるた め,全体の飽和磁化が実効的に減少してMs (v1-v2)/v1と なるため,磁化を反転させる磁界を決定する系の実効的 な異方性磁界(2*Ku/Ms)は,(2*Ku/Ms)*(v1+v2)/(v1 -v2)となる。したがって熱的安定性を得ようとしてv2を 大きくすればする程、磁化の反転磁界が大きくなること が理解される。しかし,2001年のIntermag国際会議で は,反強磁性結合があまり大きくないAFC媒体では書き 込み磁界が大きくならないことが報告された。この場 合,媒体の実効的なK $oldsymbol{eta}$ 値は記録磁性層のK $oldsymbol{eta}$ 値にほぼー 致する。ただし,上下層の磁気特性がほぼ等しいこのAF C媒体では、R/W特性が劣化しており、同等のR/W特性を 得るために全体の膜厚を薄くすると熱減磁特性の改善効 果は極めて小さくなり、熱揺らぎ特性とR/W特性の両立 が困難であった。反強磁性結合があまり大きくないAFC 媒体では,書込み時に記録磁性層11の磁化と下層磁性 層12の磁化とが平行になっているモデルが報告されて いる。本発明の目的は,高分解能,低ノイズ,かつ熱揺 らぎの小さな高密度磁気記録に好適な磁気記録媒体、及 びこの媒体等を用いた場合に実現される大容量磁気記憶 装置を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記目的を実現するた め、媒体構造、材料、プロセス、及びヘッド等の装置関 係技術に付いて鋭意検討を進め、下記の手段が極めて効 果が高いことを発見した。本媒体特性の理解には、書込 み後の再配列過程が重要である。書込み直後に記録磁性 暦11の磁化と,はぼ平行であった下層磁性層12の磁 化とが熱揺らぎの影響で反転し、反平行になる過程であ る。熱揺らぎによる反転は確率過程であって、ほとんど の粒子が再配列を完了し、上下層で反平行な磁化の対と なるには有限な時間を要する。再配列が未完の場合に は,残留磁化が大きすぎて再生分解能が劣化し,熱減磁 も大きくなる。AFC媒体とこれに記録する磁気ヘッドの 相対的な移動方向であるトラック方向は,通常の面内記 録においては,概磁化が記録される方向である。このト **ラック方向に磁界を印加して磁気飽和させた後,磁界を** 減少させ、さらにこのトラックの逆方向に磁界を印加し

て磁気飽和に至らせる過程(M—Hループ)においては, 積層された磁性層の各層ごとの磁化が異なる磁界で反転 するのが観察される。図5(a)は,毎秒300A/mの大き さで磁界を減少させて測定した磁性層2層からなるAFC 媒体のM-Hループの一例を示したものである。図の横軸 を磁界軸とし,トラック方向を正として示した。図で は,逆方向に磁界を印加して磁気飽和に至らせる後,磁 界を大きくしてトラック方向の大きな磁界で再再度磁気 飽和に達するまでの過程を点線で示してある。プラスの 大きな磁界からマイナスの大きな磁界へ変化する間に大 きく2回に分けて変化しているのが分かる。 1 つ目の変 化は、プラスの小さな磁界で発生しており、磁化の変化 量が他方の磁化変化量に比べて小さいことから下層磁性 層の磁化反転に対応していると考えられる。マイナスの 大きな磁界における磁化の変化は,記録磁性層の磁化反 転に対応する。図5(b)は,図5(a)の実線のM─Hループ を磁界によって微分したものである。図5(b)では,そ れぞれの磁化反転に対応したピークが見られる。図5の 例では,磁界が0の残留状態のとき,下層磁性層の磁化 反転に伴う磁化の変化は消失しており,再配列が完了し ていると考えられる。図6(a), (b)は,図5と同じAFC 媒体を毎秒30000A/mの大きさで磁界を減少させて 測定したM-Hループとその磁界微分を示したものであ る。図6では,下層磁性層の磁化反転する磁界がほぼ0 へと移動しているのが分かる。これは磁界の変化が大き かったために下層磁性層が磁化反転するタイミングが遅 れたためと考えられる。これに対して記録磁性層の磁化 反転する磁界は余り大きな変化が見られない。この原因 は,下層磁性層の磁化反転が熱揺らぎによって確率的に 起っているとすると理解しやすい。実際、毎秒3004/ mの磁界減少でも測定温度を約60度下げることによ り,図6とほぼ同じM-Hループが得られた。図6では, 磁界が 0 の残留状態のとき,下層磁性層の磁化反転は, まだ半分しか終わっていない。この状態では、残留磁化 が大きく,さらに時間変化する。図6の測定よりもさら に大きな磁界変化,またはより低温での測定では,下層 磁性層の磁化反転する磁界がマイナスの値へと移動す る。以上のことから,1)AFC媒体のM-Hループまたはそ の磁界微分を調べることにより、再配列の状況が把握で きること,2)M-Hループ測定時の磁界掃引速度を一定 としても,磁界掃引速度を変えた場合とほぼ等価な測定 温度が存在すること,が判明した。磁気ディスク装置に おいて書込み直後にディスクが1回転し、読み取り動作 に入るまでの時間を約10ミリ秒と考え、この時間までに 下層磁性層の磁化反転が終わり再配列が完了する条件に つき種々のAFC媒体において検討したところ,毎秒30 O O A/mの大きさで磁界を変化させる場合には,135ケル ビンにてM-Hループ測定をし,その磁界微分を取ったと き,下層磁性層の磁化反転に対応するピークを与える磁 界がΟまたはプラスの値であれば良いことが分かった。

磁界掃引速度を速める場合には、1桁あたり約30度高 い温度で測定すれば良い。以上のように、AFC媒体を活 用して大容量磁気記憶装置を実現するには、従来媒体で 考慮されていた記録、再生過程と耐熱特性に加えて再配 列過程を制御する必要がある。非磁性基板上に形成され た少なくとも2層の磁性層と、該磁性層に挟まれ、該磁 性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する 薄膜型磁気記録媒体は、AFC媒体の構成を示すものであ る。基板に近い側の磁性層を下層磁性層,基板から遠い 側の磁性層を記録磁性層とする。記録磁性層の膜厚とそ の残留磁化の積は,下層磁性層の膜厚と残留磁化の積よ り大きく採るものとする。各磁性層の残留磁化の大きさ は、図5で示した各磁性層に対応する磁化の変化量の半 分の値として良い。記録磁性層の膜厚とその残留磁化の 積から下層磁性層の膜厚と残留磁化の積を引いた値を記 録磁性層の残留磁化で除したものは、長さの次元を持 ち、AFC媒体の実効膜厚として単層媒体との比較に用い る場合が多い。実効膜厚の大きさは、残留磁化量および 再生ヘッドの感度とトラック幅とによって決定される。 非磁性基板基板には,ガラス、NiPメッキAI、セラミッ クス、Si、プラスチック等からなる3.5、2.5、1.8、1径 等の円盤状もしくはテープ、カードの形状をしており, さらに表面にCr、Mo、W、Ta、V、Nb、Ta、Ti、Ge、Si、 Co、Niからなる群から選ばれた少なくとも1種の元素を 50%以上含む、Cr、Mo、W、CrMo、CrTi、CrCo、NiCr、T a、CoCr、Ta、TiCr、C、Ge、TiNb, 非磁性CoCr/CrTi積 層下地、非磁性CoCrTa/CrTi/Cr積層下地等の非磁性層を 形成させることにより、下層磁性層、記録磁性層の結晶 粒径、配向性等が制御できる。表面の非磁性層を多層化 することは、制御の自由度が増え、特に熱揺らぎの低減 等での見地で、更に好ましい。記録磁性層には通常磁気 記録媒体として用いている,Co-Cr-Pt、Co-Cr-Pt、Co-P t、Fe-Co-Ni合金等のCo、Fe、Niからなる群から選ばれ た少なくとも1種の金属元素を50at%以上含む結晶質磁 性体を用いればよい。ただし、従来の単層磁性層媒体よ り厚めに作成する必要が有るので、粒径の拡大を抑制 し、粒内の交換相互作用を下げない配慮が必要となる。 下層磁性層の膜厚と残留磁化の積を一定に保つ場合,下 層磁性層の飽和磁化が大きいほど、下層磁性層の膜厚を 小さくすることができるため、以下に詳しく述べる記録 過程における遷移幅の短縮に大きく寄与する。下層磁性 層としてCo またはCo を主成分とし、Fe, Ni, Cr, Ta, Pt, Pdの中から選ばれた少なくとも1種の元素を含む合 金を用いることにより、記録磁性層と同じ結晶構造と必 要な磁気異方性を持つ磁性層が形成可能となる。下層磁 性層にB(ボロン)が含まれていると、磁性粒径が小さく なりノイズ低減効果が顕著となる。非磁性中間層にはRu の他, Ir, Rh, Re, Cu, Crを用いると隣接する磁性膜 間を反強磁性的に結合させることができる。Ruは、公知 例にもあるように反強磁性結合磁界を大きくすることが

できると考えられている。ただしRuは白金族元素のため Ptとの親和性が高いので、磁性膜としてCoCrPt、CoCrPt B等のHを含む合金を用いる場合には大きな反強磁性結 合磁界が得られない場合がある。反強磁性結合磁界を制 御するには、磁性膜中のPt組成や、磁性膜の非磁性中間 層と接する界面のPt組成を変える必要がある。また磁性 膜として飽和磁化の大きな材料を用いるのも反強磁性結 合磁界を大きくするのに有効である。反強磁性結合磁界 は,磁性材料と非磁性中間層との界面状態に敏感なた め、膜の作成条件にも大きく作用される。特にRFスパッタ 法では大きな反強磁性結合磁界が得られる。DCスパッタ法 ではで得られる反強磁性結合磁界はRFスパッタ法の1/3程度 であるが、MBE法よりも倍大きい。中間層の作成には, 必要な結合磁界が得られる方式を用いるのが良い。非磁 性中間層としてIr, Rh, Reを用いる場合は, Ruと比べて 多少反強磁性結合磁界が小さいが、安価に得られるため 大量生産に向いている。Ir, Rhは白金族元素のため、Co CrPt, CoCrPtB等のPtを含む合金を用いる場合には, 反 強磁性結合磁界を制御するために、磁性膜中のPt組成 や、磁性膜の非磁性中間層と接する界面のPt組成を変る 必要がある。Rh, Cuは, 延性, 展性に富む金属であり, 反強磁性結合磁界が最大になる厚さもRu、Ir, Reの約倍 の0.8nm程度であるため、厚さむら、ピンホール等によ る反強磁性結合磁界のディスク面内のパラツキが小さ く、磁気特性のそろった良質の媒体が得られる。また、 Ru、Ir, Re は、反強磁性結合磁界が得られる膜厚の範 囲がその平均に比べて広いので、工程管理的に優れてい る。非磁性中間層としてCu, Crを用いる場合は, Co合金 磁性膜との格子整合性が良いので記録磁性層の結晶性, 配向性が向上する。Crを用いる場合には、接する磁性 膜,または磁性膜の表面にFeが含まれていると大きな反 強磁性結合磁界が得られて良い。弱結合AFC媒体の非磁 性中間層には, Ru, Ir, Rh, Re, Cu, Crもしくは, Ru, Ir, Rh, Re, Cu, Crの中から選ばれた少なくとも1種類 以上の元素を50at%以上含んだ合金を用いると良い。特 に、Ru、Ir、Rhの中から選ばれた少なくとも1種類以上 の元素とPt, Pdから選ばれた少なくとも1種類以上の元 素を含む合金を用いると,組成比制御によって反強磁性 結合エネルギーを0~5mJ/m2の広い範囲で自由かつ安 定に制御することが可能となる。これは、Pt、Pd に反 強磁性結合作用が無く (J=0), Ru, Ir, Rh, Pt, Pdが 同じ白金族元素なので親和性が髙いので,合金の構成元 素が微小領域でも均一に混ざり合っているためである。 強い結合AFC媒体の非磁性中間層には、Ru, Ir, Rh, Cr もしくは、Ru、Ir、Rh、Crの中から選ばれた少なくとも 1種類以上の元素を含んだ合金を用いると良い。Crを用 いる場合には,接する磁性膜,または磁性膜の表面にFe が含まれていると大きな反強磁性結合磁界が得られて良 い。AFC媒体における各磁性層の磁気異方性磁界の測定 には、強磁性共鳴法を用いるのが良い。磁界を膜面垂直

に印加することにより、面内に磁気異方性軸を持つ媒体の異方性磁界Hkが測定可能となる(J. Appl. Phys., Vol. 85, No. 8, 4720(1999)。共鳴周波数をf,磁気回転比をγ、磁性層の飽和磁束密度をBs,とすると、式

 $(2 \pi f/\gamma)^2=(Hr-Bs)(Hr-Bs-Hk)$

で与えられる共鳴磁界Hrが各磁性層のHkに対応してえら れる。磁気力顕微鏡(MFM)により,孤立遷移の磁化遷 移幅を観察すると,AFC媒体の下層磁性層の磁気異方性 磁界HkBと,記録磁性層の磁気異方性磁界HkAとの比HkB/ HkAに応じて磁化遷移幅が変化する。単層面内媒体との 比較により,比HkB/HkAが0.7を越えると,記録磁性層と 同じ膜厚の単層面内媒体より広いな磁化遷移幅となり好 ましくない。さらに,比Hk2/Hk1が0.4以上0.65以下であ れば実効膜厚が同等の単層面内媒体と同程度の急峻な磁 化遷移幅が得られる。図6の磁化曲線において下層磁性 層の反転が終わった段階(磁界)で磁界の変化の向きを逆 転させ,マイナール一プを形成したのが,図7である。 下層磁性層がヒステリシスを持っているのが分かる。こ のマイナーループは,プラスの磁界方向にシフトしてお り,マイナーループ中心磁界を通常,反強磁性結合磁界 HexBと呼んでいる。記録磁性層と下層磁性層の反強磁性 的交換相互作用の大きさJは、HexB/(MsB*tB)で見積もら れる。ただし,MsB,tBは,下層磁性層の飽和磁化と膜 厚である。また,このマイナーループの磁界方向の差し 渡しの半値は,下層磁性層の保磁力と考えられる。メジ ャーループの磁界方向の差し渡しの半値は,記録磁性層 の保磁力である。下層磁性層は記録磁性層に比べて熱揺 らぎが大きく,測定温度が変わると保磁力が大きく変化 する。図8は,記録磁性層,下層磁性層の保磁力の温度 変化を示したものである。これらは,概直線的に推移し ており,200ケルビンおよび100ケルビンにおける 保磁力を直線で結ぶとほぼ絶対0度になる。本測定にお いては,磁界掃引速度によって200ケルビンおよび1 O O ケルビンにおける保磁力値は変化するが,絶対 O 度 における推定値は変わらない。この推定値は,上記異方 性磁界に対してほぼ40%の値となっていた。記録磁性 層の絶対温度零度における保磁力HcoAと 磁性層の絶対温度零度における保磁力HcoBとの比Hco2/H co1に対する磁化遷移幅の挙動は,磁気異方性の比HkB/H kAと同様である。磁化遷移幅の改善効果のメカニズムを 調べるため,マイクロ磁気シミュレーションを行った。 改善効果が大きい場合には、磁気異方性の小さな下層磁 性層に形成される磁化遷移の位置が、記録磁性層の遷移 位置よりヘッド後方に形成されており,下層磁性層の磁 化遷移からの磁界によって,記録磁性層の遷移位置のへ ッド磁界が変調を受け磁界勾配dH/dxが急峻化されてい ることが判明した。記録磁性層の遷移位置と下層磁性層 の遷移位置との差が磁化遷移幅以上に近づくと,このこ の効果は急速に消失する。値(HcoA HcoB)/(πa×dH /dx) が0.8より小さい場合には,下層磁性層の磁化遷移 からの磁界が逆に作用するようになり、磁化遷移幅は急 速に増大する。値(HcoA HcoB)/(πa×dH/dx)が0.9 以上1.5以下であれば,十分なヘッド磁界磁界勾配の急 峻化が得られる。値(HcoA HcoB)/(πa×dH/dx)が 1.5を越える場合には記録磁性層の遷移位置と下層磁性 層の遷移位置との差が大きすぎてヘッド磁界がほとんど 変らない。磁気異方性エネルギーKuは,関係式Hk=2*Ku/ Msから算出するか,残留保磁力のパルス時間依存性をV SM測定や逆DC消磁法より求めSharockの式にフィッ ティングして求めたΚβ値から関係式Κβ=Ku*v/(kT)を 使って算出すればよい。下層磁性層の磁気異方性エネル ギーKuBと,記録磁性層の磁気異方性エネルギーKuAとの 比KuB/KuAが0.7を超えると分解能が記録磁性層単独の磁 性層からなる従来媒体より悪くなる。比KuB/KuAが0.4以 上0. 65以下であると実効膜厚と同程度の従来媒体並みの 分解能が得られる。このときのAFC媒体のK $oldsymbol{eta}$ 値は, 実効膜厚と同程度の従来媒体に比べて30%以上大きく できる。以上のような磁気異方性の最適化によるAFC 媒体のR/W特性の向上は,弱い反強磁性的結合による 記録磁性層,下層磁性層の平行配置を前提としており, 数ナノ秒で再配列が完了してしまう状況では十分な改善 効果が得られない。30ケルビンにて,磁界を毎秒30 O O A/mの大きさで磁界を減少させ、測定されたM-H ループを磁界で微分してピークを求めたとき,下層磁性 層の磁化反転に対応するピークがマイナスの値を持つ必 要がある。記録された情報の再生には、巨大磁気抵抗効 果素子あるいは、磁気抵抗効果を示すトンネル接合膜を 用い、実効トラック幅が0.5μm以下である再生素子 を有する磁気ヘッドとを組み合わせて磁気情報の再生を 行う事で、信号処理方式の助けを借りて、装置動作に必 要な20dB以上の装置S/Nが得られ、EPRMLやEEPRML、トレ リス符号、ECC等と組み合わせる事で面記録密度40 Gb/i n2以上で記録再生する事が出来る。記録部に、飽和磁束 密度が1.8T以上の磁極を用いたヘッドを用いること で,より大きな磁気異方性を有する記録磁性層材料が使 えるようになるので好ましい。ここで、巨大磁気抵抗効 果素子(GMR)、及びトンネル型磁気ヘッドについて は、特開昭61-097906、特開平02-6157 2、特開平04-358310、特開平07-3330 15、及び特開平02-148643、02-2189 O4号各公報に記載されている技術であり、KrFステ ッパによるリソグラフィ、もしくはFIB加工技術等を 駆使して実効トラック幅が Ο. 5 μ m以下を実現した。

【発明の実施の形態】以下に、本発明の内容を実施例お よび比較例によって詳細に説明する。

(実施例) 図2を用いて本発明の第1の実施例を述べる。図は、本発明を実施した磁気ディスクの概念図である。14はガラス、NiPメッキAI、セラミックス、Si、

プラスチック等からなり、3.5、2.5、1.8、1径等の円盤 状もしくはテープ、カード上の非磁性基板、記録磁性層 11はCo、Fe、Niからなる群から選ばれた少なくとも1 種の金属元素を50at%以上含む、CoCrPt、CoCrTa、CoNiP t, CoPt-SiO2, FeNiCo, CoFeTa, NiTa, CoW, CoNb, GdF eCo、GdTbFeCo、Fe-N、Co-CoO等の結晶質磁性体,下層 磁性層12は、非磁性下地層はCr、Mo、W、Ta、V、Nb、 Ta、Ti、Ge、Si、Co、Niからなる群から選ばれた少なく とも1種の元素を50%以上含む、Cr、Mo、W、CrMo、CrT i、CrCo、NiCr、Ta、CoCr、Ta、TiCr、C、Ge、TiNb等の 非磁性下地層、及び、Co、Fe、Niからなる群から選ばれ た少なくとも1種の金属元素を50at%以上含む、CoCrP t, CoCrTa, CoNiPt, CoPt-SiO2, FeNiCo, CoFeTa, NiT a、CoW、CoNb、GdFeCo、GdTbFeCo、Fe-N、Co-CoO等の結 晶質磁性体を含み、16はN添加C、H添加C、BN、 ZrNbN等の保護膜、17はOH、NH2等の吸着性、もしくは 反応性の末端基を有するパーフルオロアルキルポリエー テル、金属脂肪酸等の潤滑剤である。非磁性中間層13 はRu, Ir, Rh, Re, Cu, Cr, Alからなる群から選ばれた 少なくとも1種の金属元素を50at%以上含む合金,また はRu, Ir, Rhの中から選ばれた少なくとも1種類以上の 元素とPt, Pdから選ばれた少なくとも1種類以上の元素 との合計が50at%以上である合金である。下層磁性層 1 2と非磁性下地15との間には、更に組成を調整した、 より磁性膜との格子常数のマッチングがとりやすい第2 の非磁性下地層を設けても良い。また, いずれかまたは 両方の磁性層と非磁性中間層の間にPt組成の低い材料を 用いると反強磁性結合が安定化し、飽和磁化の大きな材 料を用いると結合が強くなる。下層磁性層としてCo ま たはCo を主成分とし、Fe, Ni, Cr, Ta, Pt, Pdの中か ら選ばれた少なくとも1種の元素を含む合金を用いるこ とにより、記録磁性層と同じ結晶構造と必要な磁気異方 性を持つ磁性層が形成可能となる。下層磁性層にB(ポロ ン)が含まれていると、磁性粒径が小さくなりノイズ低 減効果が顕著となる。ここで、下地膜、磁性層、非磁性 中間層は、ともに基板14上に、低圧のArガスを用い、 なお、本設備では、下地と磁性膜とで独立にパラメータ を変えられる様にしてある。この際、本設備では、 Ar 圧力は1-10mTorr、基板温度は100-300℃、製膜速度0.1-1nm/sとした。下地層にはCr、Ta、Nb、V、Si、Geの他 IC. Co60Cr40, Mo90-Cr10, Ta90-Cr10, Ni50Cr50, Cr90 -V10, Cr90-Ti10, Ti95-Cr5, Ti-Ta15, Ti-Nb15, TiPd2 0、TiPt15等の合金を単層ないしは異種の金属層からな る2層として用い、下地組成の異なる試料を用意した。 下地層の総膜厚は10から100nm、CoCrPtないしはCoCrPt (Ta, V)等の磁性層は10から100nm、保護層は10nmであ る。記録磁性層のCo合金系磁性層のCr含量は19から23原 子パーセント、Pt含量は4から20原子パーセント、V、T a含量は2から5原子パーセントとした。 記録磁性層の膜 厚, 飽和磁化, 異方性磁界はそれぞれ12-22nm, 0.3-0.7

T, 500-1200kA/mで変化させた。下層磁性層の膜厚, 飽 和磁化, 異方性磁界はそれぞれ1-8mm, 0.3-1.5T, 100-1 200kA/mで変化させた。非磁性中間層にはRuの他, Ir, Rh, Re, Cu, Crを用いると隣接する磁性膜間を反強磁性 的に結合させることができる。Ruは、公知例にもあるよ うに反強磁性結合磁界を大きくすることができると考え られている。ただしRuは白金族元素のためPtとの親和性 が高いので、磁性膜としてCoCrPt, CoCrPtB等のPtを含 む合金を用いる場合には大きな反強磁性結合磁界が得ら れない場合がある。反強磁性結合磁界を制御するには、 磁性膜中のPt組成や、磁性膜の非磁性中間層と接する界 面のPt組成を変える必要がある。また磁性膜として飽和 磁化の大きな材料を用いるのも反強磁性結合磁界を大き くするのに有効である。反強磁性結合磁界は、磁性材料 と非磁性中間層との界面状態に敏感なため、膜の作成条 件にも大きく作用される。特にRFスパッタ法では大きな反 強磁性結合磁界が得られる。DCスパッタ法ではで得られる 反強磁性結合磁界はRFスパッタ法の1/3程度であるが、MBE 法よりも倍大きい。中間層の作成には、必要な結合磁界 が得られる方式を用いるのが良い。非磁性中間層として Ir, Rh, Reを用いる場合は, Ruと比べて多少反強磁性結 合磁界が小さいが、安価に得られるため大量生産に向い ている。Ir、Rhは白金族元素のため、CoCrPt, CoCrPtB 等のPtを含む合金を用いる場合には、反強磁性結合磁界 を制御するために、磁性膜中のPt組成や、磁性膜の非磁 性中間層と接する界面のPt組成を変る必要がある。Rh、 Cuは,延性,展性に富む金属であり,反強磁性結合磁界 が最大になる厚さもRu、Ir, Reの約倍の0.8nm程度であ るため、厚さむら、ピンホール等による反強磁性結合磁 界のディスク面内のパラツキが小さく,磁気特性のそろ った良質の媒体が得られる。また、Ru、Ir、Re は,反 強磁性結合磁界が得られる膜厚の範囲がその平均に比べ て広いので、工程管理的に優れている。非磁性中間層と してCu, Crを用いる場合は, Co合金磁性膜との格子整合 性が良いので記録磁性層の結晶性,配向性が向上する。 Crを用いる場合には、接する磁性膜、または磁性膜の表 面にFeが含まれていると大きな反強磁性結合磁界が得ら れて良い。弱結合AFC媒体の非磁性中間層には、Ru, Ir, Rh, Re, Cu, Crもしくは, Ru, Ir, Rh, Re, Cu, Crの 中から選ばれた少なくとも1種類以上の元素を50at%以 上含んだ合金を用いると良い。特に, Ru, Ir, Rhの中か ら選ばれた少なくとも1種類以上の元素とPt, Pdから選 ばれた少なくとも1種類以上の元素を含む合金を用いる と、組成比制御によって反強磁性結合エネルギーを0~ 5mJ/m²の広い範囲で自由かつ安定に制御することが可 能となる。これは、Pt、Pd に反強磁性結合作用が無く (J=0), Ru, Ir, Rh, Pt, Pdが同じ白金族元素なので 親和性が高いので、合金の構成元素が微小領域でも均一 に混ざり合っているためである。強い結合AFC媒体の非 磁性中間層には, Ru, Ir, Rh, Crもしくは, Ru, Ir, R

h, Crの中から選ばれた少なくとも1種類以上の元素を 含んだ合金を用いると良い。Crを用いる場合には,接す る磁性膜,または磁性膜の表面にFeが含まれていると大 きな反強磁性結合磁界が得られて良い。上記媒体を、飽 和磁束密度1.5Tの45Ni-55FeをFIB(Focused Ion Bea m)加工技術によりトラック幅0.5μmの磁極材とし、記録 ギャップ長0. 25μm (ギャップ材:A1203) としたた記録 部と、NiFe/Co(4nm)、Cu(2.5nm)、固定層CoF e (3nm)、CrMn Pt (20nm)を順次積層し、矩形状に パタン化した後に、その両端部に、Co80-Cr15-Pt5(10n m)/Cr (10nm)永久磁石およびTa電極膜 (100nm)を配置し、 KrFステッパリソグラフィ技術により電極で規定した トラック幅を 0.4μ mとした巨大磁気抵抗効果素子を 2μ mのNi 80-Fe20シールド膜で挟んだ構造(シールド間隔: 0.2μm、ギャップ材:AI203) の再生部とを有する磁気 ヘッド素子を、Al203-TiC製の大きさの1.0×0.8×0.2m m3のスライダに形成した磁気ヘッドを用い、図10に示 す本発明の磁気ディスク装置に実装して評価した。孤立 遷移の出力に対する450kFCIにおける再生出力の割 合である分解能は,下層磁性層の磁気異方性エネルギー KuBと,記録磁性層の磁気異方性エネルギーKuAとの比Ku B/KuAに対して図9のような関係が得られた。比KuB/KuA が0.7を超えると分解能が記録磁性層単独の磁性層から なる従来媒体より悪くなる。比KuB/KuAが0.4以上0.65以 下であると実効膜厚と同程度の従来媒体並みの分解能が 得られる。このときのAFC媒体のK $oldsymbol{eta}$ 値は,実効膜厚 と同程度の従来媒体に比べて30%以上大きくできる。 135ケルビンにおける磁化曲線の測定で下層下地層の 反転がマイナスの磁界に現れたばいたいは、分解能が6 0%未満となった。記録されたディスクを再び取り出 し,磁気力顕微鏡(MFM)により,孤立遷移の磁化遷移 幅を観察すると,AFC媒体の下層磁性層の磁気異方性磁 界HkBと,記録磁性層の磁気異方性磁界HkAとの比HkB/Hk Aに応じて磁化遷移幅が変化する様子が図1のように得 られた。単層面内媒体との比較により,比HkB/HkAが0.7 を越えると,記録磁性層と同じ膜厚の単層面内媒体より 広いな磁化遷移幅となり好ましくない。さらに,比Hk2/ Hk1が0.4以上0.65以下であれば実効膜厚が同等の単層面 内媒体と同程度の急峻な磁化遷移幅が得られる。30ケ ルビンの磁化曲線評価においても再配列が発生するよう な場合では,磁化遷移幅は,従来媒体レベルに留まっ た。なおスライダは微小突起を3ヶ所設けた負圧型と し、浮上面にはCーH保護膜を設けたもので、また図10 (a)は、装置の平面図、(b)は断面図である。再生 信号の処理及び情報の入出力には、従来技術と同じ所定 の電気回路が必要である。ここでは、EEPRML(Extended Extended Partial Response Maximum Likelihood)をエ ンハンスし、ECC機能を強化したMEEPRML(Modified PRM L) と言う、高密度化時の波形干渉を積極的に活用した信 号処理回路を導入した。なお、記録磁極を従来の1T(80N i−20Fe組成)、1.3T(FeTaC)、1.7T(FeNiN)としたヘッド でも評価したが、1T、1.3Tでは重ね書き特性が20dBと低 く、十分な急峻な記録が行えず、ノイズも極めて大きく 実用に堪えず、1.5T、1.7Tの場合にだけ良好な記録を確 認できた。以上から1.5T以上は必要である事がわかっ た。更に特開平02-148643、02-21890 4号各公報に記載された技術により試作した、再生トラ ック幅 Ο. 4μmのトンネル型磁気ヘッドで特性を評価 した場合には全く同様の結果が得られたが、同じトラッ ク幅の従来型MRヘッドでは、十分な再生感度が得られ ず、評価に堪えなかった。以上述べた実施例は、本発明 で開示する類似の発明を代表するものであり、本発明か ら同業者が容易に類推できる例においても本発明の範囲 に入るものである。例えば、RFマグネトロンスパッタ 法、ECRスパッタ法、ヘリコンスパッタ法等でも同様の 効果が得られる。また、本発明で開示する磁気記録媒体 によれば15Gb/in2以上の記録密度での記録再生が初めて 可能となる。したがって、本発明の磁気記録媒体で可能 となる磁気テープ、磁気カード、光磁気ディスク等を用 いた磁気記録再生装置についても本発明の範囲にはい る。以上、本発明の磁気記録媒体、磁気記録再生装置を 用いることにより高速かつ大容量の記録再生が初めて可 能となる。これにより、商品競争力の極めて強い磁気記 録再生装置を実現できる。

[0006]

【発明の効果】本発明の磁気記録媒体、磁気記録再生装 置を用いることにより高速かつ大容量の記録再生が実現 できる。

【図面の簡単な説明】

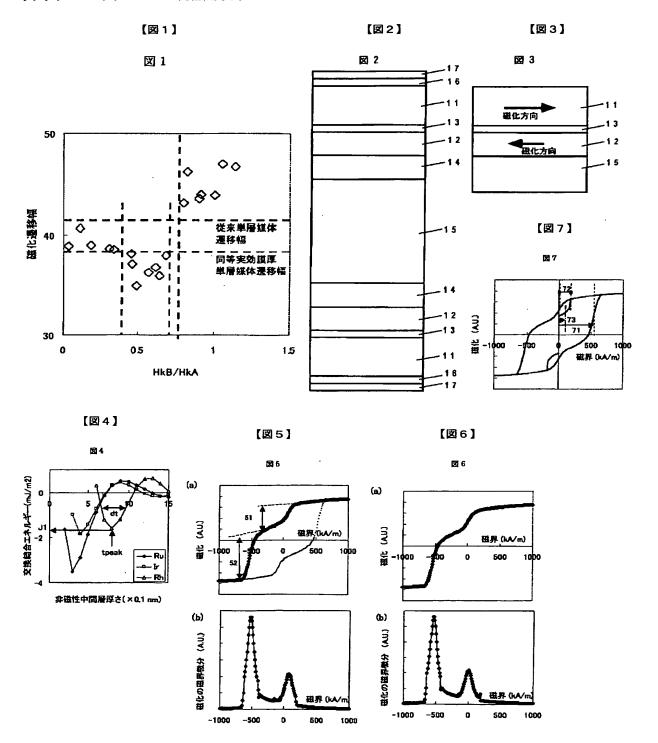
- 【図1】本発明の効果を示す主要図。
- 【図2】本発明の磁気記録媒体の主要部概念図。
- 【図3】AFC媒体の概念図。
- 【図4】反強磁性結合の概念図。
- 【図5】本発明の磁気記録媒体の磁化曲線を示す図。
- 【図6】本発明の磁気記録媒体の別の磁化曲線を示す 図。
- 【図7】本発明の磁気記録媒体の磁気特性を定義する 図。
- 【図8】本発明の磁気記録媒体における各磁性層の保磁 カの温度変化を示す図。
- 【図9】本発明の別の効果を示す主要図。
- 【図10】磁気ディスク装置の概念図。
- 【図11】磁気ヘッドの概念図。

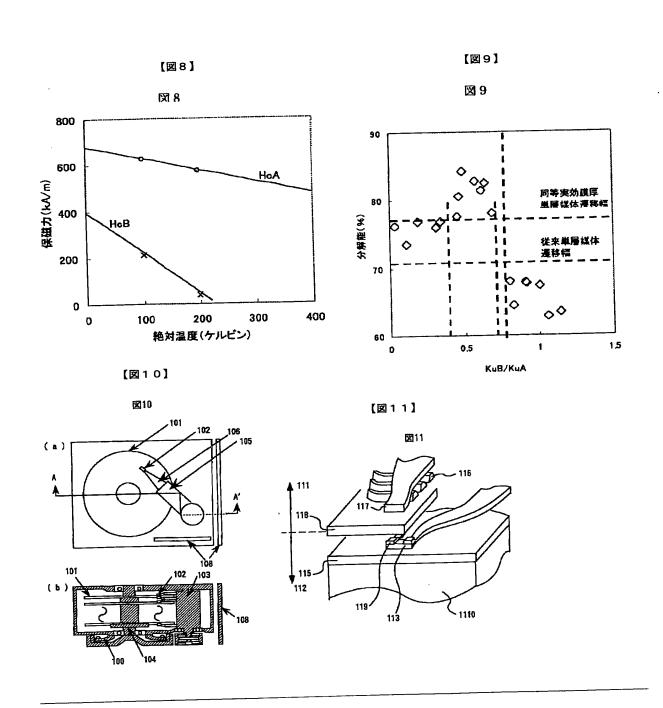
【符号の説明】

11・・・記録磁性膜、12・・・下層磁性膜、13・・・非磁性中間層、14・・・非磁性下地層, 15・・・非磁性基板, 16・・・保護膜、17・・・潤滑層、41・・・最大反強磁性結合エネルギーJ1、42・・・ピーク膜厚t peak、43・・・反強磁性結合反値幅d t、51・・・下層磁性層の磁化反転に伴う磁化変化量、52・・・記録磁性層の磁

化反転に伴う磁化変化量、71・・・記録磁性層の保磁力、72・・下層磁性層のマイナーループの幅、73・・・反強磁性結合磁界、81・・・記録磁性層の保磁力の温度変化、83・・・下層磁性層の保磁力の温度変化、101・・・記録媒体、102・・・磁気ヘッド、103・・・ロータリアクチュエータ、104・・・回転軸受け、105・・・ア

ーム、106・・・サスペンション、108・・・筐体、111・・・書き込み部、112・・・再生部、113・・・磁気抵抗素子、1110・・・非磁性基板、115・・・シールド層、116・・・渦巻き型コイル、117・・・磁極、118・・・磁極(シールド層兼用)、119・・・電極。





【手続補正書】

【提出日】平成13年8月17日(2001.8.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【書類名】明細書

【発明の名称】磁気記録媒体

【特許請求の範囲】

【請求項1】非磁性基板上に形成された少なくとも2層の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒体であって、基板に近い側の磁性層の磁気異方性磁界HkBと,基板から遠い側の磁性層の磁気異方性磁界HkAとの比HkB/Hkaが0.7以下であることを特徴とする磁気記録媒体

【請求項2】上記異方性磁界の比HkB/Hkaが0.4以上0.65

以下であることを特徴とする請求項 1 に記載の磁気記録 媒体。

【請求項3】非磁性基板上に形成された少なくとも2層の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒体であって、基板に近い側の磁性層Bの200ケルビンにおける保磁力と100ケルビンにおける保磁力と100ケルビンにおける保磁力とを絶対温度零度に外挿した値HcoAとの比HcoA/HcoAが0.7以下であることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項4】上記保磁力の比HcoB/HcoAが0.4以上0.65以下であることを特徴とする請求項3に記載の磁気記録媒体。

【請求項5】非磁性基板上に形成された少なくとも2層 の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平 行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒 体において、基板に近い側の磁性層Bの200ケルビン における保磁力と100ケルビンにおける保磁力とを絶 対温度零度に外挿した値をHcoB,基板から違い側の磁性 層Aの200ケルビンにおける保磁力と100ケルビン における保磁力とを保磁力を絶対温度零度に外挿した値 をHcoA、磁気記録再生装置として組み合わせて用いる磁 気記録用ヘッドからの磁界のトラック方向成分が該トラ ックの中心かつ磁性層Aの厚み方向の中心でHcoAとなる 位置におけるヘッド磁界のトラック方向成分の該トラッ ク方向への微分値をdH/dx, 該磁気記録用ヘッドを用い て該磁気記録媒体上に形成された孤立遷移の磁化遷移幅 をπaとするとき。値 (HcoAHcoB) / (πa×dH/dx) が0. 8以上であることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項6】上記値(HcoAHcoB)/ (πa×dH/dx) が0.9 以上, 1.5以下であることを特徴とする請求項5に記載 の磁気記録媒体。

【請求項7】非磁性基板上に形成された少なくとも2層の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒体であって、基板に近い側の磁性層の磁気異方性エネルギーKuBと,基板から遠い側の磁性層の磁気異方性エネルギーKuAとの比KuB/KuAが0.7以下であることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項8】上記比KuB/KuAが0.4以上0.65以下であることを特徴とする請求項7記載の磁気記録媒体。

【請求項9】30ケルビンにて、トラック方向に磁界を印加して磁気飽和させた後、磁界を毎秒3000A/mの大きさで磁界を減少させ、さらに逆方向に磁界を印加して磁気飽和に至らせる過程において、磁化の磁界による微分値が少なくとも2つ以上のピークを持ち、該ピークを与える磁界が全て最後に磁気飽和させた磁界の方向であることを特徴とする請求項1記載の磁気記録媒体。

【請求項10】非磁性基板上に形成された少なくとも2層の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒体において、135ケルビンにて,トラック方向に磁界を印加して磁気飽和させた後,磁界を毎秒3000A/mの大きさで磁界を減少させ,さらに逆方向に磁界を印加して磁気飽和に至らせる過程において,磁化の磁界による微分値が少なくとも2つ以上のピークを持ち,該ピークを与える磁界のうち,少なくとも1つは最後に磁気飽和させた磁界の逆方向であることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項11】非磁性基板上に形成された少なくとも2層の磁性層と,該磁性層に挟まれ,該磁性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する薄膜型磁気記録媒体であって、基板に近い側の磁性層の飽和磁化が,基板から遠い側の磁性層の飽和磁化に比べて大きいことを特徴とする請求項1記載の磁気記録媒体。

【請求項12】上記基板に近い側の磁性層としてCoまたはCoを主成分とし、Fe, Ni, Cr, Ta, Pt, Pdの中から選ばれた少なくとも1種の元素を含む合金,好ましくは加えてB(ボロン)を含むことを特徴とする請求項11に記載の磁気記録媒体。

【請求項13】上記非磁性中間層が、Ru, Ir, Rh, Re, Cu, Cr, AIからなる群から選ばれた少なくとも1種の金属元素を50at%以上含む合金、またはRu, Ir, Rhの中から選ばれた少なくとも1種類以上の元素とPt, Pdから選ばれた少なくとも1種類以上の元素との合計が50at%以上である合金であることを特徴とする請求項1記載の磁気記録媒体。

【請求項14】上記非磁性中間層をRFスパッタ法で作成することを特徴とする請求項13に記載の磁気記録媒体。

【請求項15】上記基板から遠い側の磁性層がCo、Fe、Niからなる群から選ばれた少なくとも1種の金属元素を50at%以上含む結晶質磁性体を含み、更に、上記基板に近い側の磁性層がCr、Mo、W、Ta、V、Nb、Ta、Ti、Ge、Si、Co、Niからなる群から選ばれた少なくとも1種の元素を50at%以上含む非磁性下地膜上に形成されたことを特徴とする請求項1記載の磁気記録媒体。

【請求項16】巨大磁気抵抗効果素子あるいは、磁気抵抗効果を示すトンネル接合膜を用い、実効トラック幅が0.5μm以下である再生素子を有する磁気へッドと請求項1記載の磁気記録媒体とを組み合わせて磁気情報の再生を行うことを特徴とする磁気記憶装置。

【請求項17】記録部に、飽和磁束密度が1.8T以上の磁極を用いたヘッドを用いることを特徴とする請求項16記載の磁気記憶装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子計算機及び情報処理装置等に用いられる磁気ディスク装置、ディジタ

ルVTR等の情報家電用の磁気記憶装置及びその磁気記録媒体に係り、特に、高密度記録を実現する上で好適な磁気記録媒体およびこれを用いた磁気記憶装置に関する。

[0002]

【従来の技術】情報機器の記憶(記録)装置には、半導 体メモリと磁性体メモリ等が用いられる。高速アクセス 性の観点から内部記憶装置には半導体メモリが用いら れ、大容量・低コストかつ不揮発性の観点から外部記録 装置として磁性体メモリが用いられている。磁性体メモ リの主流は、磁気ディスク装置、及び磁気テープ、磁気 カード装置である。磁気ディスク、磁気テープや磁気カ 一ドといった記録媒体に磁気情報を書き込むため、強磁 界を発生する磁気記録部が用いられる。更に、高密度で 記録された磁気情報を再生するため、磁気抵抗現象ない しは、電磁誘導現象を利用した再生部が用いられる。最 近では、巨大磁気抵抗効果、トンネル型磁気抵抗効果も 検討され始めている。これら機能部は、磁気ヘッドと呼 ばれる入出力用部品に共に設けられている。図10に磁 気ディスク装置の基本構成を示す。同図(a)は、装置 の平面図、(b)は(a)に示されたA-A'での断面図を 示す。記録媒体101は、回転軸受け104に固定さ れ、モータ100により回転する。図10では5枚の磁 気ディスク、10本の磁気ヘッドを搭載した例におい て、磁気ディスク3枚分と磁気ヘッド4本について示し たが、磁気ディスク1枚以上、磁気ヘッド1本以上であ れば良い。磁気ヘッド102は、回転する記録媒体面上 を移動する。磁気ヘッドは、アーム105を介してロー タリアクチュエータ103に支持される。サスペンショ ン106は、磁気ヘッド102を記録媒体101に所定 の荷重で押しつける機能を有する。再生信号の処理及び 情報の入出力には、所定の電気回路が必要である。最近 では、PRML(Partial Response Maximum Likelihood)、 あるいはこれをエンハンスしたEPRML(Extended PRML)と 言った、高密度化時の波形干渉を積極的に活用した信号 処理回路が導入され、高密度化に大きく寄与している。 これらは、ケース108等に取り付けられる。磁気ヘッ ドに搭載される情報の書き込み及び再生機能部は、例え ば図11に示す構造から構成される。書き込み部111 は、渦巻き型コイル116とこれを上下に包みかつ磁気 的に結合された磁極117と磁極118から構成され る。磁極117と磁極118は、共に磁性膜パターンか ら構成される。再生部112は、磁気抵抗効果素子11 3と同素子に定電流を流し、かつ抵抗変化を検出するた めの電極119から構成される。これら書き込み部と再 生部の間には、磁気的なシールド層を兼ねる磁極118 が設けられている。磁気抵抗効果素子113の下層には さらにシールド層115が設けられている。再生分解能 は、このシールド層115と磁極(シールド層兼用)11 8との間隙長が短いほど大きくなる。以上の機能部は、

上記磁気ヘッドスライダ1110上に形成されている。

【発明が解決しようとする課題】磁気記録ディスク装置 を大容量化するには,図10の記録媒体101に記録さ れる磁化情報を髙密度化すればよい。しかし,従来用い られている磁気記録媒体は微小な結晶粒子で構成されて いるため,高記録密度化に伴い1ビットあたり粒子数が 少なくなりノイズが大きくなるという問題があった。こ れに対し、磁性粒子径を小さくし、磁性粒界での非磁性 成分の偏析を促進して磁性粒子間の相互作用を小さくす ることでノイズ低減を図って来ている。ところが,最近 の年率50%以上の効率でさらに記録密度を高め15 Gb/in2 程度以上の面記録密度で記録再生しようとすると,磁性 粒子の体積が小さくなるのに伴い,熱揺らぎによる記録 磁化の減衰(熱減磁)が深刻な問題となっている。これ は、媒体を構成する粒子の磁化が熱で反転させられる現 象で,ノイズ低減のために粒子の径を小さくすると顕著 になる。このため、岩崎らによって提案された垂直磁気 記録法式では、この熱揺らぎの影響が緩和されることが 期待されている。また2000年のIntermag国際会議では、 熱減磁抑制対策として富士通,IBMより,磁性層がRuを 介して反強磁性的に結合した面内媒体(AFC媒体と呼 ぶ)が提案された。この新しく提案された媒体は,書き 込み磁界が大きくなってしまい、熱減磁抑制メリットが 相殺されてしまう可能性が高いと考えられていた。ここ で,図3を用いて本発明のベースとなる反強磁性結合 (AFC) 媒体について説明する。図3は媒体の断面構造 を概念的に示したものである。非磁性基板15上に形成 された下層磁性層12,さらに非磁性中間層13を介し て形成された記録磁性層11からなる。非磁性中間層1 3としてRuを用いると、記録磁性層11と下層磁性層1 2との間に交換相互作用が働くようになる。このときの 結合エネルギーJは,Ru非磁性中間層13の厚さに対し て図4に示すような振動的な変化をする。記録磁性層1 1 の磁化方向と下層磁性層 1 2 の磁化方向は,交換結合 エネルギーJが負の値をとるときには反平行に,交換結 合エネルギーJが正の値をとるときには平行に配置する ような交換相互作用が働く。そこでRu非磁性中間層13 の厚さを負値のピークの厚さに設定することにより、記 録磁性層11の磁化と下層磁性層12の磁化とを反強磁 性的(反平行)に結合させることが可能となる。記録磁 性層11の膜厚と残留磁化の積は,下層磁性層12の膜 厚と残留磁化の積より大きく採るものとする。簡単の為 に, 記録磁性層11と下層磁性層12の飽和磁化Ms, 磁 気異方性エネルギーKuを同じと仮定し,記録磁性層11 の粒子体積をv1,下層磁性層 1 2の粒子体積をv2とす る。反強磁性相互作用が十分強い場合には,大きいほど 耐熱揺らぎ性が向上する指標となるKβ (=Ku*v/(k*T), k:ボルツマン定数, T:絶対温度)値がKu(v1+ v2)/(k* T)となり, 記録磁性層11単独の(Ku*v1)/(k*T)に比べ

て, 下層磁性層 1 2 の持つK β 値 ((Ku*v2)/(k*T)) だけ 大きくなり、熱的に安定となる。ところが、記録磁性層 11の磁化と下層磁性層12の磁化とが反平行であるた め、全体の飽和磁化が実効的に減少してMs(v1-v2)/v1と なるため、磁化を反転させる磁界を決定する系の実効的 な異方性磁界 (2*Ku/Ms) は, (2*Ku/Ms) *(v1+v2)/(v1 -v2)となる。したがって熱的安定性を得ようとしてv2を 大きくすればする程、磁化の反転磁界が大きくなること が理解される。しかし、2001年のIntermag国際会議で は、反強磁性結合があまり大きくないAFC媒体では書き 込み磁界が大きくならないことが報告された。この場 合、媒体の実効的なKβ値は記録磁性層のKβ値にほぼー 致する。ただし、上下層の磁気特性がほぼ等しいこのAF C媒体では、R/W特性が劣化しており、同等のR/W特性を 得るために全体の膜厚を薄くすると熱減磁特性の改善効 果は極めて小さくなり,熱揺らぎ特性とR/W特性の両立 が困難であった。反強磁性結合があまり大きくないAFC 媒体では, 書込み時に記録磁性層11の磁化と下層磁性 層12の磁化とが平行になっているモデルが報告されて いる。本発明の目的は、高分解能、低ノイズ、かつ熱揺 らぎの小さな髙密度磁気記録に好適な磁気記録媒体、及 びこの媒体等を用いた場合に実現される大容量磁気記憶 装置を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記目的を実現するた め、媒体構造、材料、プロセス、及びヘッド等の装置関 係技術に付いて鋭意検討を進め、下記の手段が極めて効 果が高いことを発見した。本媒体特性の理解には、書込 み後の再配列過程が重要である。書込み直後に記録磁性 層11の磁化と,はぼ平行であった下層磁性層12の磁 化とが熱揺らぎの影響で反転し、反平行になる過程であ る。熱揺らぎによる反転は確率過程であって、ほとんど の粒子が再配列を完了し、上下層で反平行な磁化の対と なるには有限な時間を要する。再配列が未完の場合に は、残留磁化が大きすぎて再生分解能が劣化し、熱減磁 も大きくなる。AFC媒体とこれに記録する磁気ヘッドの 相対的な移動方向であるトラック方向は、通常の面内記 録においては、概磁化が記録される方向である。このト ラック方向に磁界を印加して磁気飽和させた後、磁界を 減少させ、さらにこのトラックの逆方向に磁界を印加し て磁気飽和に至らせる過程(M-Hループ)においては、 積層された磁性層の各層ごとの磁化が異なる磁界で反転 するのが観察される。図5(a)は,毎秒300A/mの大き さで磁界を減少させて測定した磁性層2層からなるAFC 媒体のMHループの一例を示したものである。図の横軸 を磁界軸とし、トラック方向を正として示した。図で は、逆方向に磁界を印加して磁気飽和に至らせる後、磁 界を大きくしてトラック方向の大きな磁界で再再度磁気 飽和に達するまでの過程を点線で示してある。 プラスの 大きな磁界からマイナスの大きな磁界へ変化する間に大

きく2回に分けて変化しているのが分かる。1つ目の変 化は、プラスの小さな磁界で発生しており、磁化の変化 量が他方の磁化変化量に比べて小さいことから下層磁性 層の磁化反転に対応していると考えられる。マイナスの 大きな磁界における磁化の変化は、記録磁性層の磁化反 転に対応する。図5(b)は,図5(a)の実線のM-Hループ を磁界によって微分したものである。図5(b)では,そ れぞれの磁化反転に対応したピークが見られる。図5の 例では、磁界がOの残留状態のとき、下層磁性層の磁化 反転に伴う磁化の変化は消失しており、再配列が完了し ていると考えられる。図6(a),(b)は、図5と同じAFC 媒体を毎秒30000A/mの大きさで磁界を減少させて 測定したM-Hループとその磁界微分を示したものであ る。図6では、下層磁性層の磁化反転する磁界がほぼ0 へと移動しているのが分かる。これは磁界の変化が大き かったために下層磁性層が磁化反転するタイミングが遅 れたためと考えられる。これに対して記録磁性層の磁化 反転する磁界は余り大きな変化が見られない。この原因 は、下層磁性層の磁化反転が熱揺らぎによって確率的に 起っているとすると理解しやすい。実際、毎秒300A/ mの磁界減少でも測定温度を約60度下げることによ り、図6とほぼ同じM-Hループが得られた。図6では、 磁界が0の残留状態のとき、下層磁性層の磁化反転は、 まだ半分しか終わっていない。この状態では、残留磁化 が大きく,さらに時間変化する。図6の測定よりもさら に大きな磁界変化、またはより低温での測定では、下層 磁性層の磁化反転する磁界がマイナスの値へと移動す る。以上のことから、1) AFC媒体のM-Hループまたはそ の磁界微分を調べることにより、再配列の状況が把握で きること, 2) M-Hループ測定時の磁界掃引速度を一定 としても、磁界掃引速度を変えた場合とほぼ等価な測定 温度が存在すること、が判明した。磁気ディスク装置に おいて書込み直後にディスクが1回転し、読み取り動作 に入るまでの時間を約10ミリ秒と考え、この時間までに 下層磁性層の磁化反転が終わり再配列が完了する条件に つき種々のAFC媒体において検討したところ、毎秒30 O O A/mの大きさで磁界を変化させる場合には、135ケル ピンにてM-Hループ測定をし、その磁界微分を取ったと き、下層磁性層の磁化反転に対応するピークを与える磁 界がΟまたはプラスの値であれば良いことが分かった。 磁界掃引速度を速める場合には、1桁あたり約30度高 い温度で測定すれば良い。以上のように、AFC媒体を活 用して大容量磁気記憶装置を実現するには、従来媒体で 考慮されていた記録,再生過程と耐熱特性に加えて再配 列過程を制御する必要がある。非磁性基板上に形成され た少なくとも2層の磁性層と、該磁性層に挟まれ、該磁 性層の磁化を反平行ならしめる非磁性中間層とを有する 薄膜型磁気記録媒体は、AFC媒体の構成を示すものであ る。基板に近い側の磁性層を下層磁性層,基板から違い 側の磁性層を記録磁性層とする。記録磁性層の膜厚とそ

の残留磁化の積は,下層磁性層の膜厚と残留磁化の積よ り大きく採るものとする。各磁性層の残留磁化の大きさ は,図5で示した各磁性層に対応する磁化の変化量の半 分の値として良い。記録磁性層の膜厚とその残留磁化の 積から下層磁性層の膜厚と残留磁化の積を引いた値を記 録磁性層の残留磁化で除したものは,長さの次元を持 ち, AFC媒体の実効膜厚として単層媒体との比較に用い る場合が多い。実効膜厚の大きさは,残留磁化量および 再生ヘッドの感度とトラック幅とによって決定される。 非磁性基板基板には,ガラス、NiPメッキAI、セラミッ クス、Si、プラスチック等からなる3.5、2.5、1.8、1径 等の円盤状もしくはテープ、カードの形状をしており, さらに表面にCr、Mo、W、Ta、V、Nb、Ta、Ti、Ge、Si、 Co、Niからなる群から選ばれた少なくとも1種の元素を 50%以上含む、Cr、Mo、W、CrMo、CrTi、CrCo、NiCr、T a、CoCr、Ta、TiCr、C、Ge、TiNb, 非磁性CoCr/CrTi積 層下地、非磁性CoCrTa/CrTi/Cr積層下地等の非磁性層を 形成させることにより,下層磁性層,記録磁性層の結晶 粒径,配向性等が制御できる。表面の非磁性層を多層化 することは、制御の自由度が増え、特に熱揺らぎの低減 等での見地で、更に好ましい。記録磁性層には通常磁気 記録媒体として用いている、Co-Cr-Pt、Co-Cr-Pt、Co-P t、Fe-Co-Ni合金等のCo、Fe、Niからなる群から選ばれ た少なくとも1種の金属元素を50at%以上含む結晶質磁 性体を用いればよい。ただし,従来の単層磁性層媒体よ り厚めに作成する必要が有るので、粒径の拡大を抑制 し、粒内の交換相互作用を下げない配慮が必要となる。 下層磁性層の膜厚と残留磁化の積を一定に保つ場合,下 層磁性層の飽和磁化が大きいほど,下層磁性層の膜厚を 小さくすることができるため,以下に詳しく述べる記録 過程における遷移幅の短縮に大きく寄与する。下層磁性 層としてCo またはCo を主成分とし、Fe, Ni, Cr, Ta, Pt, Pdの中から選ばれた少なくとも1種の元素を含む合 金を用いることにより,記録磁性層と同じ結晶構造と必 要な磁気異方性を持つ磁性層が形成可能となる。下層磁 性層にB(ボロン)が含まれていると,磁性粒径が小さく なりノイズ低減効果が顕著となる。非磁性中間層にはRu の他, Ir, Rh, Re, Cu, Crを用いると隣接する磁性膜 間を反強磁性的に結合させることができる。Ruは,公知 例にもあるように反強磁性結合磁界を大きくすることが できると考えられている。ただしRuは白金族元素のため Ptとの親和性が高いので,磁性膜としてCoCrPt, CoCrPt B等のPtを含む合金を用いる場合には大きな反強磁性結 合磁界が得られない場合がある。反強磁性結合磁界を制 御するには,磁性膜中のPt組成や,磁性膜の非磁性中間 層と接する界面のPt組成を変える必要がある。また磁性 膜として飽和磁化の大きな材料を用いるのも反強磁性結 合磁界を大きくするのに有効である。反強磁性結合磁界 は,磁性材料と非磁性中間層との界面状態に敏感なた め、膜の作成条件にも大きく作用される。特にRFスパッタ

法では大きな反強磁性結合磁界が得られる。DCスパッタ法 ではで得られる反強磁性結合磁界はRFスパッタ法の1/3程度 であるが、MBE法よりも倍大きい。中間層の作成には, 必要な結合磁界が得られる方式を用いるのが良い。非磁 性中間層としてIr, Rh, Reを用いる場合は, Ruと比べて 多少反強磁性結合磁界が小さいが,安価に得られるため 大量生産に向いている。Ir, Rhは白金族元素のため,Co CrPt, CoCrPtB等のPtを含む合金を用いる場合には,反 強磁性結合磁界を制御するために,磁性膜中のPt組成 や,磁性膜の非磁性中間層と接する界面のPt組成を変る 必要がある。Rh, Cuは, 延性, 展性に富む金属であり, 反強磁性結合磁界が最大になる厚さもRu、Ir, Reの約倍 の0.8nm程度であるため,厚さむら,ピンホール等によ る反強磁性結合磁界のディスク面内のパラツキが小さ く、磁気特性のそろった良質の媒体が得られる。また、 Ru、Ir, Re は,反強磁性結合磁界が得られる膜厚の範 囲がその平均に比べて広いので、工程管理的に優れてい る。非磁性中間層としてCu, Crを用いる場合は, Co合金 磁性膜との格子整合性が良いので記録磁性層の結晶性, 配向性が向上する。Crを用いる場合には,接する磁性 膜,または磁性膜の表面にFeが含まれていると大きな反 強磁性結合磁界が得られて良い。弱結合AFC媒体の非磁 性中間層には, Ru, Ir, Rh, Re, Cu, Crもしくは, Ru, Ir, Rh, Re, Cu, Crの中から選ばれた少なくとも1種類 以上の元素を50at%以上含んだ合金を用いると良い。特 に, Ru, Ir, Rhの中から選ばれた少なくとも1種類以上 の元素とPt, Pdから選ばれた少なくとも1種類以上の元 素を含む合金を用いると,組成比制御によって反強磁性 結合エネルギーを0~5mJ/m²の広い範囲で自由かつ安 定に制御することが可能となる。これは,Pt,Pd に反 強磁性結合作用が無く(J=0), Ru, Ir, Rh, Pt, Pdが 同じ白金族元素なので親和性が高いので、合金の構成元 素が微小領域でも均一に混ざり合っているためである。 強い結合AFC媒体の非磁性中間層には、Ru, Ir, Rh, Cr もしくは, Ru, Ir, Rh, Crの中から選ばれた少なくとも 1種類以上の元素を含んだ合金を用いると良い。Crを用 いる場合には,接する磁性膜,または磁性膜の表面にFe が含まれていると大きな反強磁性結合磁界が得られて良 い。AFC媒体における各磁性層の磁気異方性磁界の測定 には,強磁性共鳴法を用いるのが良い。磁界を膜面垂直 に印加することにより、面内に磁気異方性軸を持つ媒体 の異方性磁界Hkが測定可能となる(J. Appl. Phys., Vo I. 85, No. 8, 4720(1999)。共鳴周波数をf, 磁気回転 比をγ,磁性層の飽和磁束密度をBs,とすると,式 $(2\pi f/\gamma)^2=(Hr-Bs)(Hr-Bs-Hk)$

で与えられる共鳴磁界Hrが各磁性層のHkに対応してえられる。磁気力顕微鏡(MFM)により,孤立遷移の磁化遷移幅を観察すると,AFC媒体の下層磁性層の磁気異方性磁界HkBと,記録磁性層の磁気異方性磁界HkAとの比HkB/ HkAに応じて磁化遷移幅が変化する。単層面内媒体との 比較により、比HkB/HkAが0.7を越えると、記録磁性層と 同じ膜厚の単層面内媒体より広いな磁化遷移幅となり好 ましくない。さらに、比HkB/Hkaが0.4以上0.65以下であ れば実効膜厚が同等の単層面内媒体と同程度の急峻な磁 化遷移幅が得られる。図6の磁化曲線において下層磁性 層の反転が終わった段階(磁界)で磁界の変化の向きを逆 転させ、マイナーループを形成したのが、図7である。 下層磁性層がヒステリシスを持っているのが分かる。こ のマイナーループは、プラスの磁界方向にシフトしてお り、マイナーループ中心磁界を通常、反強磁性結合磁界 HexBと呼んでいる。記録磁性層と下層磁性層の反強磁性 的交換相互作用の大きさJは、HexB/(MsB*tB)で見積もら れる。ただし、MsB, tBは, 下層磁性層の飽和磁化と膜 厚である。また、このマイナーループの磁界方向の差し 渡しの半値は、下層磁性層の保磁力と考えられる。メジ ャーループの磁界方向の差し渡しの半値は、記録磁性層 の保磁力である。下層磁性層は記録磁性層に比べて熱揺 らぎが大きく、測定温度が変わると保磁力が大きく変化 する。図8は、記録磁性層、下層磁性層の保磁力の温度 変化を示したものである。これらは、概直線的に推移し ており、200ケルビンおよび100ケルビンにおける 保磁力を直線で結ぶとほぼ絶対0度になる。本測定にお いては、磁界掃引速度によって200ケルビンおよび1 00ケルビンにおける保磁力値は変化するが, 絶対0度 における推定値は変わらない。この推定値は、上記異方 性磁界に対してほぼ40%の値となっていた。記録磁性 層の絶対温度零度における保磁力HcoAと、下層磁性層の 絶対温度零度における保磁力HcoBとの比Hco2/Hco1に対 する磁化遷移幅の挙動は、磁気異方性の比HkB/HkAと同 様である。磁化遷移幅の改善効果のメカニズムを調べる ため、マイクロ磁気シミュレーションを行った。改善効 果が大きい場合には,磁気異方性の小さな下層磁性層に 形成される磁化遷移の位置が、記録磁性層の遷移位置よ リヘッド後方に形成されており、下層磁性層の磁化遷移 からの磁界によって、記録磁性層の遷移位置のヘッド磁 界が変調を受け磁界勾配dH/dxが急峻化されていること が判明した。記録磁性層の遷移位置と下層磁性層の遷移 位置との差が磁化遷移幅以上に近づくと、このこの効果 は急速に消失する。値 (HcoAHcoB) / (πa×dH/dx) が 0.8より小さい場合には、下層磁性層の磁化遷移からの 磁界が逆に作用するようになり、磁化遷移幅は急速に増 大する。値(HcoAHcoB)/(πa×dH/dx)が0.9以上1.5 以下であれば、十分なヘッド磁界磁界勾配の急峻化が得 られる。値(HcoAHcoB)/(πa×dH/dx)が1.5を越える 場合には記録磁性層の遷移位置と下層磁性層の遷移位置 との差が大きすぎてヘッド磁界がほとんど変らない。磁 気異方性エネルギーKuは、関係式Hk=2*Ku/Msから算出す るか、残留保磁力のパルス時間依存性をVSM測定や逆 DC消磁法より求めSharockの式にフィッティングして 求めた $K\beta$ 値から関係式 $K\beta$ =Ku*v/(kT)を使って算出す

ればよい。下層磁性層の磁気異方性エネルギーKuBと, 記録磁性層の磁気異方性エネルギーKuAとの比KuB/KuAが 0.7を超えると分解能が記録磁性層単独の磁性層からな る従来媒体より悪くなる。比KuB/KuAが0.4以上0.65以下 であると実効膜厚と同程度の従来媒体並みの分解能が得 られる。このときのAFC媒体のK β 値は、実効膜厚と 同程度の従来媒体に比べて30%以上大きくできる。以 上のような磁気異方性の最適化によるAFC媒体のR/ W特性の向上は,弱い反強磁性的結合による記録磁性 層、下層磁性層の平行配置を前提としており、数ナノ秒 で再配列が完了してしまう状況では十分な改善効果が得 られない。30ケルビンにて、磁界を毎秒3000A/m の大きさで磁界を減少させ、測定されたM-Hループを 磁界で微分してピークを求めたとき、下層磁性層の磁化 反転に対応するピークがマイナスの値を持つ必要があ る。記録された情報の再生には、巨大磁気抵抗効果素子 あるいは、磁気抵抗効果を示すトンネル接合膜を用い、 実効トラック幅が 0. 5 μ m以下である再生素子を有す る磁気ヘッドとを組み合わせて磁気情報の再生を行う事 で、信号処理方式の助けを借りて、装置動作に必要な20 dB以上の装置S/Nが得られ、EPRMLやEEPRML、トレリス符 号、ECC等と組み合わせる事で面記録密度40 Gb/in2以上 で記録再生する事が出来る。記録部に、飽和磁束密度が 1.8 T以上の磁極を用いたヘッドを用いることで、よ り大きな磁気異方性を有する記録磁性層材料が使えるよ うになるので好ましい。ここで、巨大磁気抵抗効果素子 (GMR)、及びトンネル型磁気ヘッドについては、特 開昭61-097906、特開平02-61572、特 開平04-358310、特開平07-333015、 及び特開平02-148643、02-218904号 各公報に記載されている技術であり、KrFステッパに よるリソグラフィ、もしくはFIB加工技術等を駆使し て実効トラック幅が0.5μm以下を実現した。

[0005]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の内容を実施例および比較例によって詳細に説明する。

(実施例) 図2を用いて本発明の第1の実施例を述べる。図は、本発明を実施した磁気ディスクの概念図である。14はガラス、NiPメッキAI、セラミックス、Si、プラスチック等からなり、3.5、2.5、1.8、1径等の円盤状もしくはテープ、カード上の非磁性基板、記録磁性層11はCo、Fe、Niからなる群から選ばれた少なくとも1種の金属元素を50at%以上含む、CoCrPt、CoCrTa、CoNiPt、CoPt-SiO2、FeNiCo、CoFeTa、NiTa、CoW、CoNb、GdFeCo、GdTbFeCo、Fe-N、Co-CoO等の結晶質磁性体,下層磁性層12は、非磁性下地層はCr、Mo、W、Ta、V、Nb、Ta、Ti、Ge、Si、Co、Niからなる群から選ばれた少なくとも1種の元素を50%以上含む、Cr、Mo、W、CrMo、CrTi、CrCo、NiCr、Ta、CoCr、Ta、TiCr、C、Ge、TiNb等の非磁性下地層、及び、Co、Fe、Niからなる群から選ばれ

た少なくとも1種の金属元素を50at%以上含む、CoCrP t, CoCrTa, CoNiPt, CoPt-SiO2, FeNiCo, CoFeTa, NiT a、CoW、CoNb、GdFeCo、GdTbFeCo、Fe-N、Co-CoO等の結 晶質磁性体を含み、16はN添加C、H添加C、BN、 ZrNbN等の保護膜、17はOH、NH2等の吸着性、もしくは 反応性の末端基を有するパーフルオロアルキルポリエー テル、金属脂肪酸等の潤滑剤である。非磁性中間層13 はRu, Ir, Rh, Re, Cu, Cr, Alからなる群から選ばれた 少なくとも1種の金属元素を50at%以上含む合金,また はRu, Ir, Rhの中から選ばれた少なくとも1種類以上の 元素とPt,Pdから選ばれた少なくとも1種類以上の元素 との合計が50at%以上である合金である。下層磁性層 1 2と非磁性下地15との間には、更に組成を調整した、 より磁性膜との格子常数のマッチングがとりやすい第2 の非磁性下地層を設けても良い。また、いずれかまたは 両方の磁性層と非磁性中間層の間にPt組成の低い材料を 用いると反強磁性結合が安定化し、飽和磁化の大きな材 料を用いると結合が強くなる。下層磁性層としてCo ま たはCo を主成分とし、Fe, Ni, Cr, Ta, Pt, Pdの中か ら選ばれた少なくとも1種の元素を含む合金を用いるこ とにより、記録磁性層と同じ結晶構造と必要な磁気異方 性を持つ磁性層が形成可能となる。下層磁性層にB(ポロ ン)が含まれていると,磁性粒径が小さくなりノイズ低 減効果が顕著となる。ここで、下地膜、磁性層,非磁性 中間層は、ともに基板14上に、低圧のArガスを用い、 なお、本設備では、下地と磁性膜とで独立にパラメータ を変えられる様にしてある。この際、本設備では、 Ar 圧力は1-10mTorr、基板温度は100-300℃、製膜速度0.1-1nm/sとした。下地層にはCr、Ta、Nb、V、Si、Geの他 I=, Co60Cr40, Mo90-Cr10, Ta90-Cr10, Ni50Cr50, Cr90 -V10、Cr90-Ti10、Ti95-Cr5、Ti-Ta15、Ti-Nb15、TiPd2 0、TiPt15等の合金を単層ないしは異種の金属層からな る2層として用い、下地組成の異なる試料を用意した。 下地層の総膜厚は10から100nm、CoCrPtないしはCoCrPt (Ta, V) 等の磁性層は10から100nm、保護層は10nmであ る。記録磁性層のCo合金系磁性層のCr含量は19から23原 子パーセント、Pt含量は4から20原子パーセント、V、T a含量は2から5原子パーセントとした。 記録磁性層の膜 厚, 飽和磁化, 異方性磁界はそれぞれ12-22nm, 0.3-0.7 T, 500-1200kA/mで変化させた。下層磁性層の膜厚,飽 和磁化,異方性磁界はそれぞれ1-8nm, 0.3-1.5T, 100-1 200kA/mで変化させた。非磁性中間層にはRuの他, Ir, Rh, Re, Cu, Crを用いると隣接する磁性膜間を反強磁性 的に結合させることができる。Ruは,公知例にもあるよ うに反強磁性結合磁界を大きくすることができると考え られている。ただしRuは白金族元素のためPtとの親和性 が高いので,磁性膜としてCoCrPt, CoCrPtB等のPtを含 む合金を用いる場合には大きな反強磁性結合磁界が得ら れない場合がある。反強磁性結合磁界を制御するには、 磁性膜中のPt組成や,磁性膜の非磁性中間層と接する界

面のPt組成を変える必要がある。また磁性膜として飽和 磁化の大きな材料を用いるのも反強磁性結合磁界を大き くするのに有効である。反強磁性結合磁界は,磁性材料 と非磁性中間層との界面状態に敏感なため、膜の作成条 件にも大きく作用される。特にRFスパッタ法では大きな反 強磁性結合磁界が得られる。DCスパッタ法ではで得られる 反強磁性結合磁界はRFスパッタ法の1/3程度であるが、MBE 法よりも倍大きい。中間層の作成には,必要な結合磁界 が得られる方式を用いるのが良い。非磁性中間層として Ir, Rh, Reを用いる場合は,Ruと比べて多少反強磁性結 合磁界が小さいが,安価に得られるため大量生産に向い ている。Ir, Rhは白金族元素のため, CoCrPt, CoCrPtB 等のPtを含む合金を用いる場合には,反強磁性結合磁界 を制御するために,磁性膜中のPt組成や,磁性膜の非磁 性中間層と接する界面のPt組成を変る必要がある。Rh, Cuは,延性,展性に富む金属であり,反強磁性結合磁界 が最大になる厚さもRu、Ir, Reの約倍の0.8nm程度であ るため,厚さむら,ピンホ―ル等による反強磁性結合磁 界のディスク面内のパラツキが小さく,磁気特性のそろ った良質の媒体が得られる。また, Ru、Ir, Re は, 反 強磁性結合磁界が得られる膜厚の範囲がその平均に比べ て広いので,工程管理的に優れている。非磁性中間層と してCu, Crを用いる場合は, Co合金磁性膜との格子整合 性が良いので記録磁性層の結晶性,配向性が向上する。 Crを用いる場合には,接する磁性膜,または磁性膜の表 面にFeが含まれていると大きな反強磁性結合磁界が得ら れて良い。弱結合AFC媒体の非磁性中間層には,Ru, Ir, Rh, Re, Cu, Crもしくは, Ru, Ir, Rh, Re, Cu, Crの 中から選ばれた少なくとも1種類以上の元素を50at%以 上含んだ合金を用いると良い。特に, Ru, Ir, Rhの中か ら選ばれた少なくとも1種類以上の元素とPt、Pdから選 ばれた少なくとも1種類以上の元素を含む合金を用いる と,組成比制御によって反強磁性結合エネルギーをO~ 5 mJ/m²の広い範囲で自由かつ安定に制御することが可 能となる。これは、Pt、Pd に反強磁性結合作用が無く (J=0), Ru, Ir, Rh, Pt, Pdが同じ白金族元素なので 親和性が高いので、合金の構成元素が微小領域でも均一 に混ざり合っているためである。強い結合AFC媒体の非 磁性中間層には, Ru, Ir, Rh, Crもしくは, Ru, Ir, R h, Crの中から選ばれた少なくとも1種類以上の元素を 含んだ合金を用いると良い。Crを用いる場合には、接す る磁性膜,または磁性膜の表面にFeが含まれていると大 きな反強磁性結合磁界が得られて良い。上記媒体を、飽 和磁束密度1.5Tの45Ni-55FeをFIB(Focused Ion Bea m)加工技術によりトラック幅0.5μmの磁極材とし、記録 ギャップ長0. 25μm (ギャップ材:A1203) としたた記録 部と、NiFe/Co(4nm)、Cu(2.5nm)、固定層CoF e (3nm)、CrMnPt (20nm)を順次積層し、矩形状に パタン化した後に、その両端部に、Co80-Cr15-Pt5(10n m)/Cr (10nm)永久磁石およびTa電極膜 (100nm)を配置し、

KrFステッパリソグラフィ技術により電極で規定した トラック幅を0.4μmとした巨大磁気抵抗効果素子を2μ mのNi80-Fe20シールド膜で挟んだ構造(シールド間隔: 0.2μm、ギャップ材:AI203) の再生部とを有する磁気 ヘッド素子を、AI203-TiC製の大きさの1.0×0.8×0.2m m3のスライダに形成した磁気ヘッドを用い、図10に示 す本発明の磁気ディスク装置に実装して評価した。孤立 遷移の出力に対する450kFCIにおける再生出力の割 合である分解能は、下層磁性層の磁気異方性エネルギー KuBと、記録磁性層の磁気異方性エネルギーKuAとの比Ku B/KuAに対して図9のような関係が得られた。比KuB/KuA が0.7を超えると分解能が記録磁性層単独の磁性層から なる従来媒体より悪くなる。比KuB/KuAが0.4以上0.65以 下であると実効膜厚と同程度の従来媒体並みの分解能が 得られる。このときのAFC媒体のK β 値は、実効膜厚 と同程度の従来媒体に比べて30%以上大きくできる。 135ケルビンにおける磁化曲線の測定で下層下地層の 反転がマイナスの磁界に現れたばいたいは、分解能が6 0%未満となった。記録されたディスクを再び取り出 し、磁気力顕微鏡 (MFM) により、孤立遷移の磁化遷移 幅を観察すると、AFC媒体の下層磁性層の磁気異方性磁 界HkBと、記録磁性層の磁気異方性磁界HkAとの比HkB/Hk Aに応じて磁化遷移幅が変化する様子が図1のように得 られた。単層面内媒体との比較により、比HkB/HkAが0.7 を越えると、記録磁性層と同じ膜厚の単層面内媒体より 広いな磁化遷移幅となり好ましくない。さらに、比HkB/ Hkaが0.4以上0.65以下であれば実効膜厚が同等の単層面 内媒体と同程度の急峻な磁化遷移幅が得られる。30ケ ルビンの磁化曲線評価においても再配列が発生するよう な場合では、磁化遷移幅は、従来媒体レベルに留まっ た。なおスライダは微小突起を3ヶ所設けた負圧型と し、浮上面にはC-H保護膜を設けたもので、また図10 (a)は、装置の平面図、(b)は断面図である。再生 信号の処理及び情報の入出力には、従来技術と同じ所定 の電気回路が必要である。ここでは、EEPRML (Extended Extended Partial Response Maximum Likelihood)をエ ンハンスし、ECC機能を強化したMEEPRML(Modified PRM L)と言う、髙密度化時の波形干渉を積極的に活用した信 号処理回路を導入した。なお、記録磁極を従来の1T(80N i-20Fe組成)、1.3T(FeTaC)、1.7T(FeNiN)としたヘッド でも評価したが、1T、1.3Tでは重ね書き特性が20dBと低 く、十分な急峻な記録が行えず、ノイズも極めて大きく 実用に堪えず、1.5T、1.7Tの場合にだけ良好な記録を確 認できた。以上から1.5T以上は必要である事がわかっ た。更に特開平02-148643、02-21890 4号各公報に記載された技術により試作した、再生トラ ック幅 0. 4 μ mのトンネル型磁気ヘッドで特性を評価 した場合には全く同様の結果が得られたが、同じトラッ ク幅の従来型MRヘッドでは、十分な再生感度が得られ ず、評価に堪えなかった。以上述べた実施例は、本発明

で開示する類似の発明を代表するものであり、本発明から同業者が容易に類推できる例においても本発明の範囲に入るものである。例えば、RFマグネトロンスパッタ法、ECRスパッタ法、ヘリコンスパッタ法等でも同様の効果が得られる。また、本発明で開示する磁気記録媒体によれば15Gb/in2以上の記録密度での記録再生が初めて可能となる。したがって、本発明の磁気記録媒体で可能となる磁気テープ、磁気カード、光磁気ディスク等を用いた磁気記録再生装置についても本発明の範囲にはいる。以上、本発明の磁気記録媒体、磁気記録再生装置を用いることにより高速かつ大容量の記録再生が初めて可能となる。これにより、商品競争力の極めて強い磁気記録再生装置を実現できる。

[0006]

【発明の効果】本発明の磁気記録媒体、磁気記録再生装置を用いることにより高速かつ大容量の記録再生が実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の効果を示す主要図。

【図2】本発明の磁気記録媒体の主要部概念図。

【図3】AFC媒体の概念図。

【図4】反強磁性結合の概念図。

【図5】本発明の磁気記録媒体の磁化曲線を示す図。

【図6】本発明の磁気記録媒体の別の磁化曲線を示す 図。

【図7】本発明の磁気記録媒体の磁気特性を定義する 図。

【図8】本発明の磁気記録媒体における各磁性層の保磁 カの温度変化を示す図。

【図9】本発明の別の効果を示す主要図。

【図10】磁気ディスク装置の概念図。

【図11】磁気ヘッドの概念図。

【符号の説明】

11・・・記録磁性膜、12・・・下層磁性膜、13・・・非 磁性中間層、14・・・非磁性下地層,15・・・非磁性基 板,16・・・保護膜、17・・・潤滑層、41・・・最大反 強磁性結合エネルギーJ1、42・・・ピーク膜厚t peak、 43・・・反強磁性結合反値幅d t、51・・・下層磁性層 の磁化反転に伴う磁化変化量、52・・・記録磁性層の磁 化反転に伴う磁化変化量、71・・・記録磁性層の保磁 カ、72・・下層磁性層のマイナーループの幅、73・・・ 反強磁性結合磁界、81・・・記録磁性層の保磁力の温度 変化、83・・・下層磁性層の保磁力の温度変化、101・ ・・記録媒体、102・・・磁気ヘッド、103・・・ロータ リアクチュエータ、104・・・回転軸受け、105・・・ア ーム、106・・・サスペンション、108・・・筐体、111 ・・・書き込み部、112・・・再生部、113・・・磁気抵 抗素子、1110・・・非磁性基板、115・・・シールド 層、116・・・渦巻き型コイル、117・・・磁極、118・ ・・磁極(シールド層兼用)、119・・・電極。

フロントページの続き

(72)発明者 財津 英樹 東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番出

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 (72)発明者 富山 大士 東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 Fターム(参考) 5D006 BB01 BB06 BB07 BB08 CA01 5E049 AA04 AA09 BA06 DB12